

MIZ[®]-23 コンポーネント テスター Component Tester

インライン検査用渦流探傷装置 Eddy Current Instrument for In-process NDE

ZETEC 社の MIZ[®]-23 コンポーネント テスターは工業用 I/O 出力をフルに装備したパフォーマンスの高い安価なテスターです。コンパクトで 5.4Kg と軽量ですが、堅牢なアルミ溶接ハウジングに収納されています。正に、工業用インラインとしての条件を満たしています。

パッケージ

低消費電力回路はシールドされた筐体に納められていますが、外部ベンチレーションは必要としない設計になっています。

320x240Pixel の高解像度、高輝度 LCD を備え、オンスクリーン HELP メニューも搭載しています。

85-250 VAC 対応のユニバーサル電源。

寸法は—H152.4 x W304.8 x D254mm、重量： 5.4 Kg

エレクトロニクス

ディファレンシャル、リフレクション又はシングルプローブ1個で動作。

単一周波数 - 50 Hz ~ 4 MHz
ゲイン調整 0 ~ 48dB、0.5dBステップ

高速検査に対応できる高速サブリングレート試験周波数 2 KHz 以上は 2000 S / 秒
2 KHz 以下は試験周波数と同じ。

プローブドライブ電圧、ゲイン、表示スケール、表示位相角 可変調整可能

ローパス、ハイパスフィルター可変 0 ~ 500Hz まで 20段階設定

ディファレンシャルフィルター 15段階設定

回転スキャナーに使用できる同期入力装備

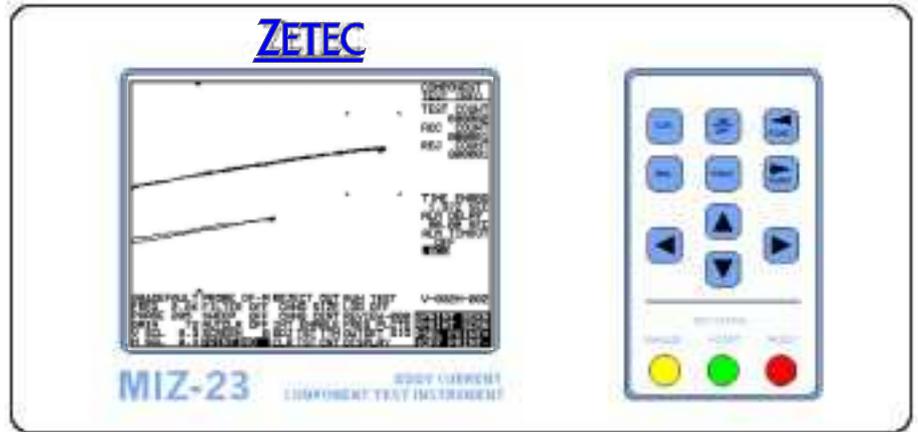
HP と Epson プリンター用出力装備

チャートレコーダー用アナログ出力

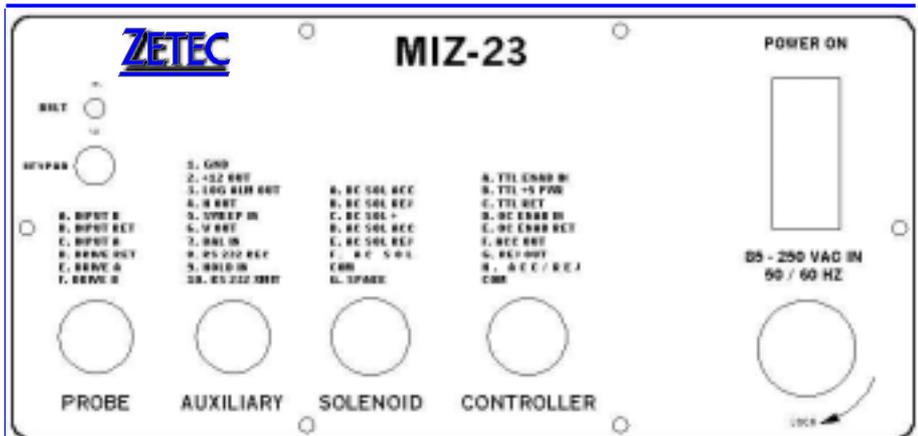
探傷条件 100種類、画面 4 枚を記録保存する不揮発メモリー搭載。

XYリサージュ表示、Y軸時間スイープ表示

RS232C - データバス、外部バランス、ホールド機能



MIZ-23 フロントパネル



MIZ-23 背面パネル

インライン検査機能

自在に設定できるボックス型アラーム装備
ボックス内 / 外設定可能。

光接続のテスト Enable 入力、合否出力
材料コントローラーとのハンドシェイク接続可能。

合否判定ゲートはソレノイド動作のため、単独で動作可能

自動セットアップ機能

プローブドライブ電圧、ゲイン、表示スケールは参照サンプルで1回取り込んで自動最適設定。

100個までの参照サンプル(良品又は不良品)入力で、包括範囲を自動的に求め警報領域を自動設定。

最適周波数選択のために周波数設定値を自動スキャンする事ができます。



ZETEC



品質管理のトータルサプライヤー
日本マテック株式会社
NIHON MATECH CORPORATION

東京本社：東京都千代田区一番町10番地 相模第3ビル4F
TEL: (03)3221-7531 FAX: (03)3221-7240 (〒102-0082)
大阪支社：大阪市淀川区西中島5-9-5 マッセ新大阪ビル5号館8F
TEL: (06)6885-6201 FAX: (06)6885-2681 (〒532-0011)